

МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ В НАНОТЕХНОЛОГИЯХ И НАНОИНДУСТРИИ. 5-я ШКОЛА.

[Программа школы](#)

Л0. МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ И ИНФРАСТРУКТУРА ЦЕНТРА МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ И ПРОДУКЦИИ НАНОИНДУСТРИИ

В.Н. Крутиков, ФГУП «ВНИИОФИ»

[Презентация](#)

Л1. ГРАФЕН И НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ МЕТРОЛОГИИ

А. Цаленчук, T. J. B. M. Janssen, O. Казакова and J.M. Williams

National Physical Laboratory, Hampton Road, Teddington TW11 0LW, UK

С. Кубаткин and S. Lara-Avila

Department of Microtechnology and Nanoscience, Chalmers University of Technology, S-412 96 Göteborg, Sweden

Р. Якимова and M. Syväjärvi

Department of Physics, Chemistry and Biology (IFM), Linköping University, S-581 83 Linköping, Sweden

С. Копылов and В. Фалько

Physics Department, Lancaster University, Lancaster, LA1 4YB, UK

N.E. Fletcher and R. Goebel

Bureau International des Poids et Mesures, Pavillon de Breteuil, F-92312, France

[Презентация](#)

Л2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ НАНОЭЛЕКТРОНИКИ И ИХ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В.А. Быков

Научно-производственная группа предприятий «НТ-МДТ»

ФГУП «НИИ Физических проблем им. Ф.В. Лукина»

Л3. РЕАКТОРНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И РАДИАЦИОННЫЕ НАНОТЕХНОЛОГИИ

Б.А.Гурович

НИЦ «Курчатовский институт»

Л4. НАНОМЕТРОЛОГИЯ – КЛЮЧЕВОЕ ЗВЕНО ИНФРАСТРУКТУРЫ НАНОТЕХНОЛОГИЙ

П.А. Тодуа, В.П. Гавриленко

Государственный научный метрологический центр «Научно-исследовательский центр по
р>изучению свойств поверхности и вакуума»

Национальный исследовательский университет «Московский физико-технический
институт»

[Презентация](#)

Л5. РОЛЬ КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКИ В РАЗРАБОТКЕ И ПРОИЗВОДСТВЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРИБОРОВ НАНОЭЛЕКТРОНИКИ

Конников С.Г. 1, 3, Брунков П.Н.1, 3, Бер Б.Я. 1, 3, Берт Н.А. 1, 3, Закгейм А.Л. 2,
Мизеров М.Н. 2, Соколов Р.В. 1, 3, Яговкина М.А. 1, 3

1 ФТИ им. А.Ф. Иоффе,

2 НТЦ микроэлектроники РАН

3 С-3 региональный ЦКП «Материаловедение и диагностика в передовых технологиях»

Санкт-Петербург, 194021, Россия,

Л6. КОНТРОЛЬ МЕТОДАМИ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЙ СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ (ЭСМ) РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ВСТРОЕННЫХ ЗАРЯДОВ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ В ПРИБОРАХ МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОНИКИ

Титков А.Н.

ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН, Санкт-Петербург

[Презентация](#)

Д7. МУЛЬТИФРАКТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ В ДИАГНОСТИКЕ НАНОМАТЕРИАЛОВ И НАНОГЕТЕРОСТРУКТУР

Брунков П.Н., Петров В.Н., Титков А.Н., Каманина Н.В., Колмаков А.Г., Черняков А.Е., Шабунина Е.И., Шмидт Н.М.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН

Д8. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ УДЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПРОВОДЯЩИХ НАНОКОМПОЗИТОВ

Кобелева С.П. 1,2, Холодный Л.П. 1

1 ОАО «ГИРЕДМЕТ», г. Москва

2 НИТУ «МИСиС», г. Москва

[Презентация](#)

Д9. ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКИЙ МЕТОД ИЗГИБНЫХ КОНТУРОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ, ПОЛЕЙ РАЗОРИЕНТИРОВАННОЙ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЁТКИ, ЕГО СРАВНЕНИЕ И КОМБИНАЦИЯ С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ МИКРОСКОПИИ

Колосов В.Ю.

Уральский федеральный университет

Д10. ТРЕХМЕРНАЯ ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ СУБМИКРОННЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ И БИОГЕННЫХ СТРУКТУР

Шкловер В.Я., Казанский П.Р.

ООО «Системы для микроскопии и анализа», 119333 Москва, Ленинский проспект д.59

Л11. СОЗДАНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ НОВЫХ МЕТОДОВ И ОБРАЗЦОВ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ И ТРИБОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ НАНОМАТЕРИАЛОВ

Петржик М.И.1, Левашов Е.А. 1, Козлова Н.С. 1, Садикова А.В. 2

1НИТУ “МИСиС”, 119049, Москва, Ленинский пр., д. 4,

2ФГУП “УНИИМ”, 620000, Екатеринбург, ул. Красноармейская, д.4

[Презентация](#)

Л12. СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКТА АТТЕСТОВАННЫХ МЕТОДИК, СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ И МЕР ДЛЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ СОСТАВА, СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ВЫСОКОПРОЧНЫХ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ

Голубев С.Н.

Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы

ФГУП «ВНИИМС»

[Презентация](#)

Д13. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ОБЛАСТИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ СВЕРХТВЕРДЫХ И НОВЫХ УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Пятов А.Л., Соловьев В.В.

ФГБНУ ТИСНУМ

[Презентация](#)

Д14. ПРОБЛЕМЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЙ СТРУКТУРЫ ТВЕРДЫХ ОБРАЗЦОВ НА АТОМНО-СИЛОВОМ МИКРОСКОПЕ

С НАНОМЕТРОВЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ

Гоц С.С., Бахтизин Р.З., Журавлев Г.И., Севницкий С.А.

Башкирский государственный университет

[Презентация](#)

Л15. СОЗДАНИЕ НАБОРА ЭТАЛОННЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И АТТЕСТОВАННЫХ МЕТОДИК ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ НАНОРАЗМЕРНЫХ ГЕТЕРОСТРУКТУР

Саприцкий В.И.

Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений (ФГУП «ВНИИОФИ»)

119 361, г. Москва, ул. Озерная, 46, Россия

[Презентация](#)

Л16. СОЗДАНИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ БАЗЫ И СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ МАССОВОЙ ДОЛИ И РАЗМЕРОВ НАНОЧАСТИЦ В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ МАТРИЦЕ НА ОСНОВЕ ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКОЙ И ОПТИЧЕСКОЙ СПЕКТРОСКОПИИ

В.А. Демин¹, П.А. Форш¹, В.Ф. Демин¹, Ю.П. Бузулуков¹, П.К. Кашкаров¹,

А.Д. Левин², С.А. Творогова²

1НИЦ «Курчатовский институт», 123182, г. Москва, площадь Академика Курчатова, 1,

2ФГУП «ВНИИОФИ», 119361, г. Москва, ул. Озерная, 46.

[Презентация](#)

Д17. КОМПЛЕКС ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИХ ТЕСТ-СИСТЕМ

Голубев С.С.

Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы

[Презентация](#)

Д18. ИЗМЕРЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НЕСФЕРИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ МЕТОДОМ МНОГОУГЛОВОГО ДЕПОЛЯРИЗОВАННОГО ДИНАМИЧЕСКОГО РАССЕЯНИЯ СВЕТА

Левин А.Д.1, Мигунов С.А.1, Шмыткова Е.А.2

1 ФГУП «ВНИИОФИ»

2 ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша»

[Презентация](#)

L19. CHARACTERIZATION OF CONCENTRATED NANO- AND MICRO-PARTICULATES USING ULTRASOUND

Andrei Dukhin

Dispersion Technology Inc, Bedford Hills, NY 10507;

[Презентация](#)

L20. РАЗВИТИЕ ОПТИЧЕСКИХ И СПЕКТРАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ХАРАКТЕРИЗАЦИИ НАНОСТРУКТУР

Левин А.Д.

Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений
(ФГУП «ВНИИОФИ»)

119 361, г. Москва, ул. Озерная, 46, Россия

[Презентация](#)

D21. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ НАНОЧАСТИЦ В ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДАХ

О.В. Карпов, Е.В. Лесников, Д.М. Балаханов, Д.А. Данькин.

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений»

(ФГУП ВНИИФТРИ)

141570, п. Менделеево, Солнечногорский р-он Московской обл.

[Презентация](#)

Д22. МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОНИТОРИНГА АТМОСФЕРНЫХ АЭРОЗОЛЕЙ

В.А. Загайнов, И.Е. Аграновский, Н.П. Калашников, А.Е. Алоян, А.А. Лушников, Ю.Г. Бирюков,

В.В. Максименко

(ФГУП НИФХИ им. Л.Я. Карпова, Москва)

[Презентация](#)

Д23. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ РАБОТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ НАНОТЕХНОЛОГИЙ

Е.А. Титов

ВНИИНМАШ

[Презентация](#)

Д24. ВОПРОСЫ ПРИЗНАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛАБОРАТОРИЙ

Болдырев И.В., Ерошина О.А.

(Ассоциация аналитических центров «Аналитика»)

[Презентация](#)

Д25. КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И УЛУЧШЕНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ВИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Козлова Н.С., Гореева Ж.А., Быкова М.Б., Диденко И.С.

НИТУ «МИСиС», 119049, Москва, Ленинский пр-т, 4

[Презентация](#)

Д26. МЕЖЛАБОРАТОРНЫЕ СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ - ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Голосной С.В.

ФБУ «Ростовский ЦСМ»

[Презентация](#)

Д27. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АТТЕСТАЦИИ МЕТОДИК ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ В ОБЛАСТИ НАНОТЕХНОЛОГИЙ

Мелкова О.Н.

Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы

ФГУП «ВНИИМС»

[Презентация](#)

Л28. ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИИ В ОБЛАСТИ НАНОМАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ. МЕСТО РОССИИ В МИРОВОМ НАНОСООБЩЕСТВЕ

Андриевский Р.А.

Институт проблем химической физики РАН, г. Черноголовка, Россия

[Презентация](#)

Л29. МЕТРОЛОГИЯ НАНОСТРУКТУР И ТОНКИХ ПЛЕНОК

Латышев А.В.

Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, г. Новосибирск

Новосибирский государственный университет, г. Новосибирск

[Презентация](#)

Д30. СОЗДАНИЕ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЗОНДОВ МАГНИТНО-СИЛОВЫХ МИКРОСКОПОВ

Вдовичев С.Н., Грибков Б.А., Гусев С.А., Климов А.Ю., Миронов В.Л., Рогов В.В.
Скороходов Е.В. и Фраерман А.А.

Институт Физики Микроструктур РАН, Нижний Новгород, Россия

[Презентация](#)

Д31. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ МЕТОДАМИ СЗМ – ОТ ПЕРВИЧНОГО ЭТАЛОНА МЕТРА К ПЕРИОДИЧЕСКИМ МЕРАМ

Гоголинский К.В.1, Усеинов А.С.1, Кузнецов А.П.2, Решетов В.Н.2, Голубев С.С.3

1 ФГБНУ ТИСНУМ ул. Центральная, д.7а, г. Троицк М. О.

2 НИЯУ МИФИ, Каширское шоссе, 31, Москва

3 ФГУП ВНИИМС, ул. Озерная, 46, Москва

[Презентация](#)

Л32. СТРУКТУРНАЯ ДИАГНОСТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕНТГЕНОВСКОГО СИНХРОТРОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Я.В. Зубавичус

НИЦ «Курчатовский институт», пл. Акад. Курчатова, 1, Москва

[Презентация](#)

Д33. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ АТОМНОЙ И ЭЛЕКТРОННОЙ СТРУКТУРЫ НАНОМАТЕРИАЛОВ: MICRO-XANES И EELS

Солдатов А.В. 1, Гуда А.А. 1, Смоленцев Н.Ю. 1, 2, Дмитриев В.П. 2, Сафонова О.В. 3,

Файн М.Б.1, Солдатов М.А. 1, Verbeeck J. 4

1 Южный Федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия

2 ESRF, Grenoble, France

3 SLS, PSI, Switzerland

4 EMAT, University of Antwerp, Belgium

[Презентация](#)

Д34. ПРОСВЕЧИВАЮЩАЯ И РАСТРОВАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ: ПРИБОРЫ И МЕТОДЫ НАНОДИАГНОСТИКИ И НАНОМЕТРОЛОГИИ

Пушин В.Г.

Институт физики металлов УрО РАН,

620990, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевская, д. 18

[Презентация](#)

Д35. ПРОСВЕЧИВАЮЩАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ В ИССЛЕДОВАНИЯХ НАНОПОРОШКОВ

Мурзакаев А.М.

Институт электрофизики УрО РАН, Екатеринбург

[Презентация](#)

Д36. ОГРАНИЧЕНИЕ РАСТРОВЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ МИКРОСКОПОВ КАК СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Заблоцкий А.В.1,2,3, Альзоба В.В.1,2, Морозов С.А. 1

1 Московский физико-технический институт

2 ОАО «Научно-исследовательский центр по изучению свойств поверхности и вакуума»

3 ООО «Метрологический центр РОСНАНО»

[Презентация](#)

Л37. ИССЛЕДОВАНИЕ ГРАНИЦ РАЗДЕЛА ГЕТЕРОСИСТЕМ НОВЫМИ МЕТОДАМИ ПРОСВЕЧИВАЮЩЕЙ РАСТРОВОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ

А.Л.Васильев1,2

1 НИЦ «Курчатовский институт», 123182 Россия, Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1.

2 Учреждение РАН «Институт кристаллографии РАН им.А.В.Шубникова» 119333 Россия, Москва, Ленинский пр., 59

[Презентация](#)

Л38. СИНТЕЗ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК НА ПРОВОДЯЩИХ ПОДЛОЖКАХ

Захаров Д.Н.

Birck Nanotechnology Center, Purdue University, США

[Презентация](#)

Д39. О ПРИМЕНЕНИИ АБСОРБЦИОННОЙ ИК-СПЕКТРОСКОПИИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОЦЕНТНОГО СОДЕРЖАНИЯ ОДНОСЛОЙНЫХ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК В УГЛЕРОДНЫХ НАНОМАТЕРИАЛАХ

Бакиева Ю.Р., Зверева Г.И., Спирин М.Г., Крестинин А.В.

Институт проблем химической физики РАН

[Презентация](#)

Д40. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ СТРУКТУР НА ОСНОВЕ СУЛЬФИДОВ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ

Андрюшечкин С.Е.

Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений (ФГУП «ВНИИОФИ»)

119 361, г. Москва, ул. Озерная, 46, Россия

Л41. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ РАЗМЕРНЫХ ПАРАМЕТРОВ НАНОЧАСТИЦ И ТОНКИХ ПЛЕНОК МЕТОДАМИ МАЛОУГЛОВОЙ РЕНТГЕНОВСКО ДИФРАКТОМЕТРИИ

Авилов А.С.

ИК РАН

[Презентация](#)

Д42. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРНЫХ ПАРАМЕТРОВ И МОРФОЛОГИИ НАНОЧАСТИЦ МЕТОДОМ МАЛОУГЛОВОГО РЕНТГЕНОВСКОГО И НЕЙТРОННОГО РАССЕЯНИЯ

В.В. Волков

Учреждение Российской академии наук Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова (ИК РАН)

119333 Москва, Ленинский проспект 59

[Презентация](#)

Д43. РАЗРАБОТКА КОЛИЧЕСТВЕННОЙ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ИНТЕРКАЛЯЦИИ И ЭКСФОЛИАЦИИ МОНТМОРИЛЛОНИТА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПОЛИМЕР-МАТРИЧНЫХ НАНОКОМПОЗИТОВ

Ермакова М.А.1,2, Заблоцкий А.В.1,2, Иванов В.В.1, Волков И.А.1, Зюльков И.Ю.2, Демиденко К.В.3, Бахов Ф.Н.3, Мешалкин О.А.3, Третьякова В.Д.3

1 ООО «Метрологический центр РОСНАНО»

2 Московский физико-технический институт

3 ЗАО «Метаклэй»

[Презентация](#)

Д44. ПРОСВЕЧИВАЮЩАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ С ВЫСОКИМ РАЗРЕШЕНИЕМ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ФЕРРОМАГНИТНЫХ НАНОИГЛ ZNO:C

Гуда А.А.1, Смоленцев Н.Ю. 1, Солдатов М.А. 1, Yinggang Lu2, Verbeeck J. 2, Lau S.P.3, Солдатов А.В.1

1 НОЦ «Наноразмерная структура вещества», Южный федеральный университет Rostov-on-Don, 344090 Russia

2 Electron Microscopy for Materials Science, University of Antwerp, 2020, Antwerp, Belgium

3 Department of Applied Physics, The Hong Kong Polytechnic University, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong (P.R. China)

[Презентация](#)

Л45. ТЕСТИРОВАНИЕ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ИХ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ: ОТ МАТЕРИАЛОВ К ПРОЦЕССАМ И УСТРОЙСТВАМ

Добровольский Ю.А.

Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка,

[Презентация](#)

Д46. МЕТОД ШУМОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ХИМИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ ТОКА

Астафьев Е.А.1,2, Чуб А.В.1

1 Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка,

2 ООО «Элинс», Черноголовка

[Презентация](#)

Д47. МЕТОДЫ ЯМР В ОПРЕДЕЛЕНИИ СТРУКТУРНЫХ И ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАНООБЪЕКТОВ НА ПРИМЕРЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ МЕМБРАН

В.И. Волков

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химической физики Российской академии наук, Черноголовка

Д48. ПОЛУЧЕНИЕ СУСПЕНЗИЙ С УЗКИМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ

НА ОСНОВЕ НАНОЧАСТИЦ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ

Калинина Е.Г.1, Ефимов А.А.2, Сафронов А.П.1, Иванов В.В.3, Бекетов И.В.1

1 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт электрофизики УрО РАН, 620016, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 106

2 Московский физико-технический институт, 141700, г. Долгопрудный, Институтский пер., д. 9

3 Метрологический центр РОСНАНО, 117036, г. Москва, просп. 60-летия Октября, д. 10А

[Презентация](#)

Презентации компаний:

[КОМПАНИЯ «ТОКИО БОЭКИ»: КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА \(2012-2013\)](#)

ОБОРУДОВАНИЕ CSM-INSTRUMENTS. НАНО- МИКРО- СВОЙСТВА
ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТЕРИАЛОВ (НИЕНЦАНЦ)

AFM TECHNIQUES. ADVANCED MODES AND APPLICATIONS (AGILENT
TECHNOLOGIES)